

Computer & Cyberspace Mehr Tempo fürs Rastersonden-Mikroskop

Dienstag, 30. März, 02:11 Uhr



Frankfurt/Main (apn) Rastersonden-Mikroskope tasten die Oberfläche ihrer Objekte mit winzigen Nadeln aus Silizium ab. Die dabei mögliche Frequenz von etwa 100 Kilohertz ist aber zu langsam für viele Objekte. «Schon die Geschwindigkeit, mit der ein Haar wächst, kann sich unter dem Mikroskop als störend erweisen», erklärte der Nanoforscher Uwe Hartmann.

«Wir haben daher nach einem Bauteil gesucht, das nochmals um den Faktor 1000 kleiner ist als die herkömmlichen Nadeln.» Ergebnis ist ein «Nanocantilever», der Oberflächen viel schneller und mit höherer Präzision abtasten kann. Die an der Universität des Saarlandes entwickelte Technik wird auf der Hannover Messe im April vorgestellt. Danach soll es einen Prototyp und bis Ende des Jahres ein funktionsfähiges Gerät geben.

© 2010 The Associated Press. Alle Rechte vorbehalten - All Rights Reserved

[Artikel versenden](#)

[Mit anderen teilen](#)

[Drucken](#)

Copyright ©2010 Yahoo!, Alle Rechte vorbehalten.

ANZEIGE

Kette
€ 12,99

Shirt
€ 10,99

Hier klicken